

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和6年2月28日(2024.2.28)

【公開番号】特開2023-81994(P2023-81994A)

【公開日】令和5年6月13日(2023.6.13)

【年通号数】公開公報(特許)2023-109

【出願番号】特願2023-37764(P2023-37764)

【国際特許分類】

A 6 1 B 90/30(2016.01)

10

F 2 1 V 33/00(2006.01)

F 2 1 V 8/00(2006.01)

F 2 1 S 2/00(2016.01)

F 2 1 Y 115/30(2016.01)

【F I】

A 6 1 B 90/30

F 2 1 V 33/00 3 0 0

F 2 1 V 8/00 2 6 1

F 2 1 V 8/00 2 8 1

F 2 1 S 2/00 3 3 0

20

F 2 1 S 2/00 3 4 0

F 2 1 S 2/00 3 5 5

F 2 1 Y 115:30

【手続補正書】

【提出日】令和6年2月19日(2024.2.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

30

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

イメージに蛍光強度を表示する方法であって、

前記イメージの領域をカバーするターゲットレチクルを表示することと、

前記ターゲットレチクル内の正規化蛍光強度を算出することと、

ターゲットに関連付けられたディスプレイ領域に前記正規化蛍光強度を表示することと、
を含む方法。

【請求項2】

請求項1に記載の方法であって、前記ディスプレイ領域は、前記ターゲットに投影される、方法。

40

【請求項3】

請求項1に記載の方法であって、前記正規化蛍光強度は、单一の数値を含む、方法。

【請求項4】

請求項1に記載の方法であって、前記正規化蛍光強度は、正規化蛍光強度の履歴プロットを含む、方法。

【請求項5】

請求項4に記載の方法であって、撮像された解剖学的構造に亘って走査している間に前記履歴プロットを更新することをさらに含む、方法。

【請求項6】

50

請求項 1 に記載の方法であって、前記正規化蛍光強度は、測定された蛍光強度値と前記ターゲットレチクル内の反射光値との間の比に基づく、方法。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の方法であって、撮像された解剖学的構造上の相異なる位置に前記ターゲットレチクルを向けることと、前記相異なる位置に関連付けられた正規化蛍光強度値を比較することと、をさらに含む、方法。

【請求項 8】

ディスプレイと、1つ以上のプロセッサと、メモリと、前記1つ以上のプロセッサによる実行のために前記メモリに記憶された1つ以上のプログラムと、を備えるシステムであって、前記1つ以上のプログラムは、

10

イメージの領域をカバーするターゲットレチクルを前記ディスプレイに表示することと、前記ターゲットレチクル内の正規化蛍光強度を算出することと、

ターゲットに関連付けられたディスプレイ領域に前記正規化蛍光強度を前記ディスプレイに表示することと、のための命令を含む、システム。

【請求項 9】

請求項 8 に記載のシステムであって、前記ディスプレイ領域は、前記ターゲットに投影される、システム。

20

【請求項 10】

請求項 8 に記載のシステムであって、前記正規化蛍光強度は、単一の数値を含む、システム。

【請求項 11】

請求項 8 に記載のシステムであって、前記正規化蛍光強度は、正規化蛍光強度の履歴プロットを含む、システム。

【請求項 12】

請求項 11 に記載のシステムであって、前記1つ以上のプログラムは、撮像された解剖学的構造に亘って走査している間に前記履歴プロットを更新するための命令をさらに含む、システム。

【請求項 13】

請求項 8 に記載のシステムであって、前記正規化蛍光強度は、測定された蛍光強度値と前記ターゲットレチクル内の反射光値との間の比に基づく、システム。

30

【請求項 14】

請求項 8 に記載のシステムであって、前記1つ以上のプログラムは、撮像された解剖学的構造上の相異なる位置に前記ターゲットレチクルが向いていることに基づいて、前記正規化蛍光強度を更新するための命令をさらに含む、システム。

40

50